

Aseguramiento de la calidad: Sibress presenta el nuevo microscopio SibScope

Starnberg (Alemania), 5 de mayo de 2015. Sibress es una empresa sita en Starnberg (localidad cercana a Múnich, Alemania), que se dedica a la fabricación de sistemas de medición y análisis para el aseguramiento de la calidad en la impresión de envases y envoltorios, y flexográfica. Ahora lleva al mercado el recientemente desarrollado microscopio SibScope y el software de medición SibView.

SibScope, el nuevo microscopio desarrollado por Sibress tiene por función analizar objetos, como por ejemplo cilindros anilox, celdas de grabado y planchas flexográficas, con la máxima calidad y precisión en la imagen. Con un aumento máximo, el objetivo de 80x muestra objetos con un tamaño de 97 μm en pantalla completa (en relación con una diagonal de pantalla de 60 cm). SibScope puede utilizarse tanto para superficies curvas o cilíndricas (a partir de 6 cm de diámetro) como para superficies planas.

Los máximos detalles de imagen gracias a la tecnología de filtros

El microscopio lleva incorporados cinco objetivos planacromáticos (también llamados objetivos de campo plano). Para obtener el aumento deseado, simplemente ha de girarse el revólver. SibScope se suministra con los siguientes objetivos: 5x, 10x, 20x, 40x, 80x; y también de manera opcional 4x y 100x. Un gran número de filtros mecánicos permite mostrar superficies con gran nitidez y contraste.

Para observar objetos, el usuario puede alternar entre los oculares de 10x y la cámara microscópica integrada de alta resolución. Después, la imagen puede examinarse desde el monitor de un PC. Los objetivos del microscopio pueden desplazarse en las escalas X, Y y Z (ajuste vertical). Para el cálculo de altura y profundidad, SibScope lleva integrado un comparador digital con una resolución de 1 μm . Gracias al tornillo macrométrico se pueden obtener detalles muy por debajo de 1 μm , de modo que enfoca las estructuras superficiales más pequeñas, pudiendo examinarse con gran nitidez.

Durante una medición, los valores de medición vertical se transfieren inmediatamente desde la interfaz diseñada especialmente para el microscopio al nuevo software SibView de Sibress, el cual viene suministrado. SibView visualiza el objetivo planacromático que se haya seleccionado de manera totalmente automática. De ese modo, para cada objetivo se seleccionan automáticamente los parámetros de calibración registrados por el software y se visualizan las mediciones correctamente.

SibView: más que una herramienta de medición

El sistema se suministra calibrado en los ejes X, Y y Z. El software SibView ofrece diferentes herramientas de medición, como la medición de distancia, posición angular, posición angular comparada, y medición de distancia y ancho con su respectiva posición angular, circunferencia, perímetro y área. A la imagen se le pueden añadir comentarios adicionales.

Cuando se registran valores de mediciones verticales, la imagen y los valores de medición vertical se guardan juntos y pueden volver a cargarse del mismo modo. Una función especial de guardado rápido permite al usuario guardar la imagen con su correspondiente información de profundidad y altura en una fracción de segundo con tan sólo pulsar una tecla. La imagen y la información de altura y profundidad se guardan en la carpeta que elija sin tener que asignar un nombre concreto a la imagen. Sobre esta base, los registros de un tercer software pueden agruparse en una imagen tridimensional.

SibScope: más que un microscopio para el análisis de superficies

El microscopio SibScope también puede emplearse junto con el software opcional de Sibress Versatile@Flex para el análisis de planchas de impresión flexográfica. Flexo-Software, el cual está establecido en el mercado desde hace años, analiza de manera totalmente automática parámetros como el porcentaje de trama, el tamaño del punto de trama, la densidad de trama y mucho más. Al mismo tiempo, se puede determinar la profundidad exacta del relieve de planchas flexográficas. Los puntos de trama por fin pueden examinarse con la más alta resolución y, como consecuencia, pueden verse tal y como son en la realidad. Esto resulta de gran interés para usos flexográficos en alta definición. La diferencia de altura exacta entre los puntos de trama puede obtenerse asimismo, al igual que el perímetro efectivo de un punto en cada posición.

La combinación de ambos paquetes de software hace que SibScope sea también la solución ideal para talleres de impresión flexográfica con reprografía propia, los cuales también desean analizar tanto sus cilindros anilox como sus planchas flexográficas.

Además, SibScope es idóneo para talleres de huecograbado o para el análisis de estructuras de circuito impreso, gracias a sus filtros ópticos. Se le puede dar uso en cualquier lugar donde se necesite examinar y valorar los detalles más pequeños gracias a una resolución de imagen y nitidez excelentes.

Si necesita más información sobre el programa de Sibress, visite nuestra web:

www.sibress.com.

Editado por PR KOM para:

Sibress

Karwendelstraße 24

82319 Starnberg

Alemania

Persona de contacto: Michael Romanowski

Tel. +49 (0)8151 550 85 22

Email: info@sibress.com

www.sibress.com